

Performance characteristics and calibration methods for digital data acquisition systems and relevant software

Performance characteristics and calibration methods for digital data acquisition systems and relevant software

EESTI STANDARDI EESSÕNA

NATIONAL FOREWORD

Käesolev Eesti standard EVS-EN 62008:2005 sisaldab Euroopa standardi EN 62008:2005 ingliskeelset teksti. Käesolev dokument on jõustatud 16.11.2005 ja selle kohta on avaldatud teade Eesti standardiorganisatsiooni ametlikus väljaandes. Standard on kättesaadav Eesti standardiorganisatsioonist.	This Estonian standard EVS-EN 62008:2005 consists of the English text of the European standard EN 62008:2005. This document is endorsed on 16.11.2005 with the notification being published in the official publication of the Estonian national standardisation organisation. The standard is available from Estonian standardisation organisation.
--	---

Käsitlusala: Specifies performance characteristics and calibration methods for digital data acquisition systems and relevant software to ensure that all measurement systems relying on DAQ devices meet a common standard.	Scope: Specifies performance characteristics and calibration methods for digital data acquisition systems and relevant software to ensure that all measurement systems relying on DAQ devices meet a common standard.
---	---

ICS 33.200

Võtmesõnad:

**Performance characteristics and calibration methods
for digital data acquisition systems
and relevant software
(IEC 62008:2005)**

Caractéristiques de performance
et méthodes d'étalonnage
pour les systèmes d'acquisition
de données numériques
et logiciels appropriés
(CEI 62008:2005)

Leistungseigenschaften
und Kalibrierverfahren
für digitale Datenerfassungssysteme
und entsprechende Software
(IEC 62008:2005)

This European Standard was approved by CENELEC on 2005-10-01. CENELEC members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration.

Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the Central Secretariat or to any CENELEC member.

This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation under the responsibility of a CENELEC member into its own language and notified to the Central Secretariat has the same status as the official versions.

CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom.

CENELEC

European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Central Secretariat: rue de Stassart 35, B - 1050 Brussels

Foreword

The text of document 85/267/FDIS, future edition 1 of IEC 62008, prepared by IEC TC 85, Measuring equipment for electrical and electromagnetic quantities, was submitted to the IEC-CENELEC parallel vote and was approved by CENELEC as EN 62008 on 2005-10-01.

The following dates were fixed:

- | | | |
|--|-------|------------|
| – latest date by which the EN has to be implemented at national level by publication of an identical national standard or by endorsement | (dop) | 2006-07-01 |
| – latest date by which the national standards conflicting with the EN have to be withdrawn | (dow) | 2008-10-01 |

Annex ZA has been added by CENELEC.

Endorsement notice

The text of the International Standard IEC 62008:2005 was approved by CENELEC as a European Standard without any modification.

Annex ZA (normative)

Normative references to international publications with their corresponding European publications

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

NOTE Where an international publication has been modified by common modifications, indicated by (mod), the relevant EN/HD applies.

<u>Publication</u>	<u>Year</u>	<u>Title</u>	<u>EN/HD</u>	<u>Year</u>
IEC 60748-4	1997	Semiconductor devices - Integrated circuits Part 4: Interface integrated circuits	-	-
IEC 60748-4-3	- ¹⁾	Part 4-3: Interface integrated circuits - Dynamic criteria for Analogue-Digital Converters (ADC)	-	-
ISO/IEC 17025	- ²⁾	General requirements for the competence of testing and calibration laboratories	EN ISO/IEC 17025	2005 ³⁾
BIPM/IEC/IFCC/ISO/ IUPAC/IUPAP/OIML	- ²⁾	Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM)	-	-

1) To be published.

2) Undated reference.

3) Valid edition at date of issue.

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC**

62008

Première édition
First edition
2005-07

**Caractéristiques de performance et
méthodes d'étalonnage pour les systèmes
d'acquisition de données numériques
et logiciels appropriés**

**Performance characteristics and calibration
methods for digital data acquisition systems
and relevant software**



Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 62008:2005

Numérotation des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI sont numérotées à partir de 60000. Ainsi, la CEI 34-1 devient la CEI 60034-1.

Editions consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de la CEI incorporant les amendements sont disponibles. Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent respectivement la publication de base, la publication de base incorporant l'amendement 1, et la publication de base incorporant les amendements 1 et 2.

Informations supplémentaires sur les publications de la CEI

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de la technique. Des renseignements relatifs à cette publication, y compris sa validité, sont disponibles dans le Catalogue des publications de la CEI (voir ci-dessous) en plus des nouvelles éditions, amendements et corrigenda. Des informations sur les sujets à l'étude et l'avancement des travaux entrepris par le comité d'études qui a élaboré cette publication, ainsi que la liste des publications parues, sont également disponibles par l'intermédiaire de:

- Site web de la CEI (www.iec.ch)
- Catalogue des publications de la CEI

Le catalogue en ligne sur le site web de la CEI (www.iec.ch/searchpub) vous permet de faire des recherches en utilisant de nombreux critères, comprenant des recherches textuelles, par comité d'études ou date de publication. Des informations en ligne sont également disponibles sur les nouvelles publications, les publications remplacées ou retirées, ainsi que sur les corrigenda.

- IEC Just Published

Ce résumé des dernières publications parues (www.iec.ch/online_news/justpub) est aussi disponible par courrier électronique. Veuillez prendre contact avec le Service client (voir ci-dessous) pour plus d'informations.

- Service clients

Si vous avez des questions au sujet de cette publication ou avez besoin de renseignements supplémentaires, prenez contact avec le Service clients:

Email: custserv@iec.ch
Tél: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00

Publication numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are issued with a designation in the 60000 series. For example, IEC 34-1 is now referred to as IEC 60034-1.

Consolidated editions

The IEC is now publishing consolidated versions of its publications. For example, edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to the base publication, the base publication incorporating amendment 1 and the base publication incorporating amendments 1 and 2.

Further information on IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology. Information relating to this publication, including its validity, is available in the IEC Catalogue of publications (see below) in addition to new editions, amendments and corrigenda. Information on the subjects under consideration and work in progress undertaken by the technical committee which has prepared this publication, as well as the list of publications issued, is also available from the following:

- IEC Web Site (www.iec.ch)
- Catalogue of IEC publications

The on-line catalogue on the IEC web site (www.iec.ch/searchpub) enables you to search by a variety of criteria including text searches, technical committees and date of publication. On-line information is also available on recently issued publications, withdrawn and replaced publications, as well as corrigenda.

- IEC Just Published

This summary of recently issued publications (www.iec.ch/online_news/justpub) is also available by email. Please contact the Customer Service Centre (see below) for further information.

- Customer Service Centre

If you have any questions regarding this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre:

Email: custserv@iec.ch
Tel: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC**

62008

Première édition
First edition
2005-07

**Caractéristiques de performance et
méthodes d'étalonnage pour les systèmes
d'acquisition de données numériques
et logiciels appropriés**

**Performance characteristics and calibration
methods for digital data acquisition systems
and relevant software**

© IEC 2005 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission, 3, rue de Varembe, PO Box 131, CH-1211 Geneva 20, Switzerland
Telephone: +41 22 919 02 11 Telefax: +41 22 919 03 00 E-mail: inmail@iec.ch Web: www.iec.ch



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

X

Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue

SOMMAIRE

AVANT PROPOS	6
INTRODUCTION.....	10
1 Domaine d'application	12
2 Références normatives.....	12
3 Termes, définitions, abréviations et symboles.....	14
3.1 Termes et définitions	14
3.2 Abréviations et symboles.....	16
4 Exigences générales	16
4.1 Procédures d'essai et estimation de l'incertitude de mesure	16
4.2 Exigences générales relatives aux MAN	18
4.3 Description des paramètres.....	18
4.4 Méthodes d'essai des paramètres mesurables	26
5 Fonctionnalité matérielle pour l'étalonnage.....	50
5.1 Information sur l'étalonnage embarqué.....	50
5.2 Matériel général d'ajustement de mesure	50
5.3 Matériel d'auto-étalonnage	52
6 Méthodes de calibrage logicielles.....	52
6.1 Interface de programmation associée d'étalonnage (API)	52
6.2 Méthodes d'auto-étalonnage	52
6.3 Méthodes d'étalonnage à l'extérieur.....	54
7 Procédures relatives à l'étalonnage	54
Annexe A (informative) Exemples de calcul de l'incertitude système d'acquisition de données (DAQ) modulaire.....	56
Annexe B (normative) Pseudo-code pour réaliser l'essai statique par la méthode B (voir 4.4.1.2) et un exemple numérique.....	62
Annexe C (informative) Caractéristiques du module analogique numérique	82
Bibliographie.....	92
Figure 1 – Signal d'essai appliqué au MAN	30
Figure 2 – Procédure d'essai	34
Figure 3 – Représentation dans différentes échelles de gris des histogrammes cumulatifs calculés à chaque pas dans le cas d'un MAN 5-bits et d'un essai avec 4 pas	34
Figure 4 – Dispositions d'essai pour les mesures de bruit sur les Modules analogiques numériques (MAN).....	42
Figure C.1 – MAN bipolaire avec réel zéro.....	84
Figure C.2 – MAN bipolaire sans réel zéro.....	86
Figure C.3 – Erreur de décalage (spécifié au pas 000).....	88
Figure C.4 – Erreur de gain (après la correction de l'erreur de décalage) (spécifié au pas 011)	90

CONTENTS

FOREWORD.....	7
INTRODUCTION.....	11
1 Scope.....	13
2 Normative references	13
3 Terms, definitions, abbreviations and symbols.....	15
3.1 Terms and definitions	15
3.2 Abbreviations and symbols	17
4 General requirements	17
4.1 Test procedures and measurement uncertainty estimation	17
4.2 General requirements for ADMs	19
4.3 Descriptions of parameters.....	19
4.4 Testing methods of measurable parameters	27
5 Hardware functionality for calibration.....	51
5.1 Onboard calibration information.....	51
5.2 General measurement adjustment hardware.....	51
5.3 Self-adjustment hardware.....	53
6 Software calibration methods.....	53
6.1 Calibration application programming interface (API)	53
6.2 Self-calibration methods	53
6.3 External calibration methods	55
7 Calibration procedures	55
Annex A (informative) Examples of calculation of modular DAQ system uncertainty.....	57
Annex B (normative) Pseudo-code to perform static test by method B (see 4.4.1.2) and a numerical example	63
Annex C (informative) ADM characteristics	83
Bibliography.....	93
Figure 1 – Test signals applied to the ADM.....	31
Figure 2 – Test procedure.....	35
Figure 3 – Representation in different grey tones of the cumulative histograms computed in each step in the case of a 5-bit ADM and a test with 4 steps.....	35
Figure 4 – Test arrangement for noise measurements on ADMs	43
Figure C.1 – Bipolar ADM with true zero	85
Figure C.2 – Bipolar ADM with no true zero	87
Figure C.3 – Offset (specified at step 000).....	89
Figure C.4 – Gain component of uncertainty (after correction of offset) (specified at step 011)	91

Tableau 1 – Précision des estimations du niveau de transition de code pour différentes longueurs d'enregistrement.....	28
Tableau 2 – Exemple de spécification des paramètres du module analogique numérique pour l'évaluation de l'incertitude de mesure du dispositif d'acquisition de données (DAQ).....	48
Tableau B.1 – Dérivation de l'amplitude (A) et de l'erreur de décalage (C_j) des petites ondes triangulaires, du nombre d'échantillons par archive (M) et du nombre d'archives (R)..	72
Tableau B.2 – Résultats de l'essai d'histogramme et des tensions de passage correspondantes pour un MAN 5-bits testé par la méthode B en 4 pas.....	74
Tableau B.3 – Dérivation non-linéarité intégrale et Non-Linéarité Différentielle à partir des tensions de passage mesurées	78

Document is a preview generated by EVS

Table 1 – Precision of estimates of code transition level for different record lengths	29
Table 2 – Example of parameters specification of ADM for measurement uncertainty estimation of DAQ device.....	49
Table B.1 – Derivation of the amplitude (A) and offset (C_j) of the small triangular waves, the number of samples per record (M) and the number of records (R).	73
Table B.2 – Results of the histogram test and corresponding transition voltages for a 5-bit ADM tested by method B in 4 steps	75
Table B.3 – Deriving INL and DNL from the measured transition voltages.	79

This document is a preview generated by EVS

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE ET MÉTHODES D'ÉTALONNAGE POUR LES SYSTÈMES D'ACQUISITION DE DONNÉES NUMÉRIQUES ET LOGICIELS APPROPRIÉS

AVANT PROPOS

- 1) La Commission Électrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les publications de la CEI se présentent sous la forme de recommandations Internationales et sont agréées comme tels par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEI ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de la CEI dans leurs publications nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.
- 5) La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa responsabilité n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l'une de ses normes.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à la CEI, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de la CEI, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEI ou de toute autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est indispensable pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEI peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La norme internationale CEI 62008 a été établie par le Comité d'études 85: Equipement de mesure des grandeurs électriques et électromagnétiques.

Le texte de la présente norme est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
85/267/FDIS	85/268/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de la présente Norme.

La version française de cette norme n'a pas été soumise au vote.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

**PERFORMANCE CHARACTERISTICS AND CALIBRATION METHODS
FOR DIGITAL DATA ACQUISITION SYSTEMS
AND RELEVANT SOFTWARE**

FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with an IEC Publication.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 62008 has been prepared by IEC technical committee 85: Measuring equipment for electrical and electromagnetic quantities.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
85/267/FDIS	85/268/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de maintenance indiquée sur le site web de la CEI sous "<http://webstore.iec.ch>" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until the maintenance result date indicated on the IEC web site under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

INTRODUCTION

Les systèmes de mesure totalement automatisés deviennent la norme pour les essais en production, en recherche et dans n'importe quel autre secteur où des mesures sont faites. L'automatisation des mesures mène à un partage étendu des données, à une communication inter-appareils, et au contrôle de la mesure à distance. Les dispositifs d'acquisition de données multifonction (DAQ) répondent à ces besoins de mesure. Ils reposent sur les techniques informatiques classiques, permettant aux développeurs de systèmes de mesure d'augmenter les normes informatiques ouvertes. Les mesures effectuées par les dispositifs DAQ sont précises et traçables. Le besoin d'intégrité de mesure exige des normes de développement non seulement pour le matériel de mesure mais également pour le logiciel qui étalonne le matériel.

INTRODUCTION

Totally automated measurement systems are becoming the norm for manufacturing test, research and any other area where measurements are made. Measurement automation leads to extensive data sharing, inter-instrument communication and remote measurement control. Multifunction data acquisition (DAQ) devices meet these measurement needs. They rely on standard computer technology, allowing measurement systems developers to leverage open computer standards. The measurements made by DAQ devices are accurate and traceable. The need for measurement integrity requires developing standards not only for the measurement hardware but also for the software that calibrates the hardware.

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE ET MÉTHODES D'ÉTALONNAGE POUR LES SYSTÈMES D'ACQUISITION DE DONNÉES NUMÉRIQUES ET LOGICIELS APPROPRIÉS

1 Domaine d'application

La présente Norme Internationale spécifie des caractéristiques de performances et des méthodes d'étalonnage destinées aux systèmes d'acquisition de données numériques et aux logiciels appropriés, de manière à assurer que tous les systèmes de mesure basés sur des dispositifs d'acquisition de données multifonction (DAQ) répondent à une norme commune.

La présente norme couvre:

- les spécifications minimales que le constructeur du dispositif DAQ doit fournir pour décrire les performances du Module Analogique-Numérique (MAN) du dispositif DAQ.
- les stratégies d'essai normalisées pour vérifier l'ensemble minimal de spécifications.
- les informations minimales relatives à l'étalonnage, exigées par le MAN, et stockées sur le dispositif DAQ.
- les exigences minimales relatives au logiciel de calibrage pour le calibrage externe et l'auto-calibrage du MAN du dispositif DAQ.

La présente norme traite de conversion de signal de basse fréquence par exemple les applications telles que le contrôle d'usine, la mesure de vibrations, les vibro-diagnostics, les mesures acoustiques, ultrasoniques, de température, de pression, la mesure en électronique de puissance, etc.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

CEI 60748-4:1997, *Dispositifs à semi-conducteurs – Circuits intégrés – Partie 4: Circuits intégrés d'interface*

CEI 60748-4-3: ____¹⁾, *Dispositifs à semi-conducteurs – Circuits intégrés – Partie 4-3: Circuits intégrés d'interface – Critères dynamiques pour les Convertisseurs Analogiques Numériques (CAN)*

ISO/CEI 17025, *Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais*

BIPM, CEI, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP, OIML, *Guide pour l'expression de l'incertitude de mesure*

¹⁾ A publier.

PERFORMANCE CHARACTERISTICS AND CALIBRATION METHODS FOR DIGITAL DATA ACQUISITION SYSTEMS AND RELEVANT SOFTWARE

1 Scope

This International Standard specifies performance characteristics and calibration methods for digital data acquisition systems and relevant software to ensure that all measurement systems relying on DAQ devices meet a common standard.

This standard covers:

- the minimum specifications that the DAQ device manufacturer must provide to describe the performance of the analogue-to-digital module (ADM) of the DAQ device;
- standard test strategies to verify the minimum set of specifications;
- the minimum calibration information required by the ADM that is stored on the DAQ device;
- the minimum calibration software requirements for external and self-calibration of the ADM of the DAQ device.

This standard deals with low frequency signal conversion, e.g. applications such as plant control, vibration measurement, vibro-diagnostics, acoustics, ultrasonic measurements, temperature measurements, pressure measurements, measurement in power electronics, etc.

2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60748-4:1997, *Semiconductor devices – Integrated circuits – Part 4: Interface integrated circuits*

IEC 60748-4-3:____¹⁾, *Semiconductor devices – Integrated circuits – Part 4-3: Interface integrated circuits – Dynamic criteria for analogue-to-digital converters (ADC)*

ISO/IEC 17025, *General requirements for the competence of testing and calibration laboratories*

BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP, OIML, *Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM)*

¹⁾ To be published.